



İstatistikçiler Dergisi: İstatistik & Aktüerya
Journal of Statisticians: Statistics and Actuarial Sciences
IDIA 15, 2022, 2, 34-47
Geliş/Received:11.09.2022, Kabul/Accepted: 23.12.2022
Araştırma Makalesi / Research Article

Çarpık normal dağılımlı AR(1) modeli için dayanıklı kontrol kartları

Arzu Altın Yavuz
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,
İstatistik Bölümü,
26040, Eskişehir, Türkiye
aaltin@ogu.edu.tr
 0000-0002-3277-740X

Hilal Akdoğan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü,
26040, Eskişehir, Türkiye
akdogannhilall@gmail.com
 0000-0002-2923-4252

Özet

Literatürde hem otokorelasyon problemini hem de normal olmayan dağılımlara ilişkin süreç kontrolünü ele alan çok az çalışma mevcuttur. Bu çalışmada her iki problemi aynı anda ele alan AR(1) sürecine uygun çarpık normal dağılımlı veriler için kalite kontrol grafikleri incelenmiştir. Ele alınan tüm kontrol kartları ARL değerlerine dayalı bir simülasyon çalışması ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, sağlam S_n tahmin edicisine dayalı kontrol grafiğinin kullanılmasının yanlış alarm olasılığını azalttığı tespit edilmiştir.

Anahtar sözcükler: Çarpık normal dağılım, Kontrol kartı, Otokorelasyon, Sağlam tahmin ediciler.

Abstract

Robust control charts for Ar(1) model with skew normal distribution

There are very few studies in the literature that address both the autocorrelation problem and the process control of non-normal distributions. In this study, we examined quality control charts for skewed normal distribution data in accordance with the AR(1) process, which handles both problems simultaneously. We compared the considered control charts over a simulation study that is based on ARL values. As a result, we found that the use of the control chart based on the robust S_n estimator reduces the probability of false alarms.

Keywords: Skew normal distribution, Control chart, Autocorrelation, Robust estimator.

1.Giriş

Genel olarak kalite kontrol çalışmaları istatistiksel süreç kontrolü, kabul örnekleme ve deney tasarımı şeklinde üç alandan oluşmaktadır. İstatistiksel süreç kontrolünde bir sürecin belirli bir çıktısının değişkenliğini ölçmek ve kontrol altında tutulmasını sağlamak amaçlanmaktadır [1]. İstatistiksel süreç kontrolünde pareto ve neden-sonuç diyagramı, tabakalama analizi, beyin fırtınası gibi çeşitli yöntemler

bulunmasına rağmen, tasarımlarının ve kullanımlarının görsel olarak anlaşılmalardaki kolaylık nedeniyle kalite kontrol grafikleri yaygın kullanıma sahiptir [2,3]. Literatürdeki ilk kontrol grafiği 1931'de Walter A. Shewhart tarafından önerilmiştir ve Shewhart grafiği olarak adlandırılmıştır [4,5]. Kalite kontrol grafikleri, sürecin önceki gözlemlerinden hareketle oluşturulan sınırlara göre sürecin şu andaki durumunu tespit etmeye yarayan grafiklerdir [6].

Geleneksel kalite kontrol grafiklerinin temel varsayımı sürecin gözlemlerinin bağımsız, aynı ortalamalı normal dağılıma sahip olmasıdır. Fakat, çoğu uygulamalarda normallik varsayımı geçerli olmayabilir. Bu durumda, çarpık anakitleleri kontrol edebilmek için üç yaklaşım önerilmektedir. Bunlardan ilki, örnek ortalamasının yaklaşık olarak normal dağılması için örnek boyutunu arttırmaktır. Ancak bu işlem genellikle pahalıdır [7]. İkincisi, temelde olan dağılımın bilindiğini ve istenen yanlış alarm oranlarını veren kesin kontrol grafiklerini oluşturduğu varsayılmaktadır. Fakat, temel dağılım bilinmiyorsa bu yöntem kullanılamaz [7]. Üçüncüsü, asimetrik kontrol sınırlarını kullanan yaklaşımlardır.

Çarpık anakitleleri kontrol edebilmek için önerilen asimetrik kontrol yöntemlerden ilki Choobineh ve Ballard (1987) tarafından tanımlanan ve Choobineh ve Branting' in (1986) yarı varyans yaklaşımına dayanan Ağırlıklı Varyans (AV) yöntemidir. Bu yöntemde, çarpık dağılımlar için örneklem ortalamalarının ve değişim aralıklarının standart sapmasına dayanarak asimetrik kontrol sınırları elde etmişlerdir. Bai ve Choi (1995) de Ağırlıklı Standart Sapmalar (ASS) yöntemini kullanarak \bar{X} ve R grafiklerini oluşturmak için bir yöntem önermişlerdir. Bu yöntem, çarpık dağılımlar için \bar{X} , birikimli toplam ve üstel ağırlıklı hareketli ortalama kontrol grafiklerini oluşturmak ve standart sapmayı iki parçaya ayırarak kontrol limitleri elde etmek için kullanılır. Chan ve Cui (2003) tarafından \bar{X} ve R grafiğini oluşturmak için önerilen ve dağılım üzerinde herhangi bir varsayım olmaksızın süreç dağılımının çarpıklık derecesi dikkate alan diğer bir yöntem ise Düzeltilmiş Çarpıklık (DÇ) yöntemidir.

Kontrol grafiklerinin dayandığı diğer bir varsayım süreç verilerinin birbirinden bağımsız olmasıdır. Ancak özellikle bağımsızlık şartı uygulamada çok gerçekçi değildir. Özellikle günümüzde sanayi 4.0 çalışmaları ile birlikte kalite kontrol için yüksek hızda, otomatik ve sık alınan numuneler nedeniyle veriler arasında otokorelasyon söz konusudur. Ayrıca, kimya endüstrisinde olduğu gibi sürecin doğası gereği otokorelasyon ile karşılaşılabilen süreçler mevcuttur. Otokorelasyonlu bir süreç için geleneksel kalite kontrol grafikleri kullanıldığında, tahmin edilen parametre değerleri hatalı olmakta, yanlış alarm oranları yükselmekte ve süreç kaymaları geç tespit edilebilmektedir. Otokorelasyonlu veriler için EWMA, EWMAST, DFTC gibi kalite kontrol grafikleri geliştirilmiştir. Ancak artık kontrol grafikleri en eski ve kullanım kolaylığı nedeniyle en çok tercih edilen süreç kontrol yöntemidir. CUSUM ve EWMA, geçmiş verilere daha az ağırlık verdikleri için küçük kaymaları tespit etmek için uygundur. Ancak, büyük değişimlere Shewhart'a dayalı artık kontrol kartları kadar hızlı tepki veremezler [8]. Otokorelasyonlu veriler, artık kontrol grafiği oluşturularak kolayca analiz edilir ve otokorelasyon ortadan kaldırılabılır.

İlk artık kontrol çizelgesi, yani özel neden çizelgesi (special cause chart-SCC), Alwan ve Roberts tarafından 1988'de tanıtılmıştır. SCC çizelgesi, literatürde X artık çizelgesi olarak da bilinmektedir. Artık çizelgelerinde, tahmin hatalarının, yani artıkların istatistiksel olarak ilişkisiz olduğu varsayılır. Otokorelasyonlu gözlemlere uygun bir zaman serisi modeli belirlenir ve artık için bir kontrol grafiği çizilir. Bu nedenle, iyi bilinen tüm kontrol şemaları artık kontrol şemasına dönüştürülebilir. Artık grafiğinin temel avantajı, sürecin durağan olup olmamasına bakılmaksızın herhangi bir otokorelasyonlu veriye uygulanabilmesidir [9].

Ancak süreç verileri hem otokorelasyonlu hem de normal dağılımlı olmadığında problemin karmaşıklığı artmaktadır. Literatürde bu konuda sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Son dönemde çarpık normal dağılım, normal dağılımı da kapsamı nedeniyle kalite kontrol çalışmalarında oldukça öne çıkmaktadır. Çarpık normal dağılıma sahip süreç ortalaması için iki yeni kontrol kartı ve süreç yetenek oranları geliştirilmiştir [10,11,12,13]. Çarpık normal dağılımın bazı özellikleri kullanılarak, uygulamalarda kullanım kolaylığı sağlanmıştır. Endüstriyel süreçler incelenirken çarpık normal ve iki değişkenli normal süreçler için bazı kontrol kartları geliştirilerek performansları analiz edilmiştir [14].

Ayrıca, otokorelasyon varlığında örnek verilerin ortalamalarının farklı özellikleri incelenerek, istatistiksel süreç kontrolü için öneriler sunulmuştur. Gözlemleri atlayarak ayrılmış küçük veri gruplarının ortalamaları dikkate alınarak otokorelasyon süreçlerinin izlenmesi önerilmiştir [15]. AR(1) süreci için elde edilen bu sonuçlar kullanılarak, atlama olmadan da çok daha büyük veri setleri için iyi performans elde edilebileceği gösterilmiştir [16]. AR(1) modeli için çeşitli artık kontrol kartlarının karşılaştırması yapılmıştır [9]. Otokorelasyonun grafik performansı üzerindeki etkisini azaltmak ya da ortadan kaldırmak için bir kontrol grafiği önerilmiştir [17]. AR(1) modelinde normal dağılıma uygun olmayan veriler için kontrol grafiklerinin güç fonksiyonu üzerindeki etkisi incelenmiştir [18]. Medyan mutlak sapma tahmin edicisine (MAD) dayalı kontrol grafiğinin performansı çarpık normal dağılım için mevcut kontrol grafiklerinin performanslarıyla karşılaştırılmıştır [19].

Bu çalışmanın amacı, çarpık normal dağılımdan gelen otokorelasyonlu veri setleri için kalite kontrol kartlarının performansını karşılaştırmaktır. Bu amaçla çarpık normal dağılım için kesin kontrol sınırları ve AV, ASS, DÇ yöntemlerine ek olarak, sağlam ölçek tahmincilerine dayanan MAD, S_n , Q_n , çeyrekler arası değişim katsayısı, Gini, ölçeğin Andrews M, iki ağırlıklı orta varyans tahmin edicileri ele alınmıştır. Otokorelasyonlu süreç olarak AR(1) modelinde artık kontrol grafikleri için kontrol limitleri belirlenmiştir. Bu kontrol grafiklerinin performansları ARL ölçüsüne dayalı olarak gerçekleştirilen bir simülasyon çalışmasıyla karşılaştırılmıştır.

Çalışmanın ikinci bölümünde çarpık normal dağılım, üçüncü bölümde AR(1) modeline dayalı artık kontrol kartı tanıtılmıştır. Dördüncü ve beşinci bölümde literatürde var olan ve yeni önerilen tahmin yöntemleri tanıtılmıştır. Monte Carlo benzetim çalışmasının ardından, son bölümde önerilere yer verilmiştir.

2. Çarpık normal dağılım

Y rastgele değişkeni çarpık normal dağılıma sahip olsun. $Y \sim SN(\lambda, \delta^2, \alpha)$ olarak gösterilir ve olasılık yoğunluğu Eşitlik 1 de verildiği gibidir.

$$f(y; \lambda, \delta, \alpha) = \frac{2}{\delta} \phi\left(\frac{y-\lambda}{\delta}\right) \Phi\left(\alpha \frac{y-\lambda}{\delta}\right), \quad y \in \mathbb{R} \quad (\alpha, \lambda \in \mathbb{R}, \delta \in \mathbb{R}^+), \quad (1)$$

Burada λ konum, δ^2 ölçek ve α şekil parametresini, ϕ ve Φ ise sırasıyla, standart normal dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonu (pdf) ve birikimli dağılım fonksiyonunu (cdf) göstermektedir. $\lambda = 0$ ve $\delta = 1$ ise, $SN(\alpha)$ ile gösterilen standart çarpık normal dağılımı elde edilir. Çarpıklık parametresi λ dağılımın şeklini kontrol etmektedir. $\lambda = 0$ olduğunda dağılım simetrik, $\lambda > 0$ olduğunda pozitif ve $\lambda < 0$ olduğunda negatif çarpık olmaktadır [14]. Çarpık normal dağılım, normal dağılımın birçok istatistiksel özelliğini korumaktadır. Çarpık normal dağılımının avantajı, çarpıklık parametresi olan λ parametresi ile geniş dağılım sınıfını temsil etmesidir. Bu dağılım sınıfı, normal dağılımın ($\lambda = 0$) dışında, farklı düzeylerde çarpıklık ve basıklık içeren modelleri içerir. Normal durumlarda bile verilerde bazı bozulma olasılığı olmakta ve çarpık normal dağılım süreç verilerini daha güvenilir bir şekilde tanımlayabilmektedir.

3. AR kontrol kartı

Bir zaman serisi modeli ile otokorelasyonlu bir süreci tanımlama fikri ilk olarak 1988 yılında Alwan ve Roberts tarafından ortaya atılmıştır [15].

Zaman serisi analizinde genellikle değişkenin gözlemlenen değerinin geçmişteki bazı değerleri ile açıklanabileceği varsayılır. Ölçümler genellikle aynı zaman aralıkları ile elde edilir. Otoregresif bir zaman serisi aşağıdaki gibi tanımlanır. Genel olarak bir AR(p) modeli,

$$X_t = c + \varphi_1 X_{t-1} + \dots + \varphi_p X_{t-p} + \varepsilon_t$$

biçiminde yazılır ve burada φ_i modelin parametreleri, c sabit terim ve ε_t ak gürültüdür. AR(1) süreci ise özel olarak,

$$X_t = c + \varphi X_{t-1} + \varepsilon_t$$

şeklinde tanımlanır. Burada, t örnekleme zamanıdır, X_t , t zamanındaki örnek değeri, c sabit terim, φ otoregresif katsayısı ($-1 < \varphi < 1$) ve $\varepsilon_t \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2)$ dağılımlı bağımsız rastgele hata terimidir

Süreç, $|\varphi| < 1$ ise durağan, $|\varphi| = 1$ ise X_t sonsuz varyansa sahip olduğundan durağan değildir. $|\varphi| < 1$ varsayıldığında, ortalama $E(X_t)$, durağanlık sebebiyle tüm t değerleri için aynıdır.

AR(1) sürecinin ortalaması ve varyansı sırasıyla aşağıda verilmiştir.

$$\mu = \frac{c}{1-\varphi}, \quad Var(X_t) = \frac{\sigma_\varepsilon^2}{1-\varphi^2}$$

X_t otokorelasyonlu gözlemler olmak üzere, artıklar aşağıda biçimde yazılabilir.

$$e_t = X_t - \widehat{X}_t$$

Burada, \widehat{X}_t t zamanında X_t 'nin tahmin değeridir. Shewhart artık kontrol kartı için orta çizgi, 3σ alt ve üst kontrol sınırları aşağıdaki gibidir:

$$AKL = \bar{e} - 3\sigma_e$$

$$OÇ = \bar{e}$$

$$ÜKL = \bar{e} + 3\sigma_e$$

Artan bir doğrusal eğilime sahip X_t değeri, AR(1) süreci için şu şekilde temsil edilebilir.

Bir kayma veya sıçrama değeri ile X_t :

$$Z_t = X_t + \delta$$

şeklinde yazılabilir. Burada δ ortalamanın yukarı doğru kayma büyüklüğüdür (Karaoğlan ve Bayhan, 2011).

4. Tahmin yöntemleri

Bu bölümde AR(1) sürecine sahip kalite kontrol karakteristiklerinin dağılımının çarpık normal dağılım olması durumunda kullanılacak çeşitli tahmin yöntemleri ele alınmıştır. Bu yöntemler iki başlık altında toplanmıştır. İlki çarpık dağılımlar için kullanılan tahmin yöntemleri, ikincisi ise dağılımsal sapmalara karşı dirençli olan sağlam tahmin yöntemleridir.

X_1, X_2, \dots, X_n çarpık normal dağılımından alınan rassal bir örneklem olsun. Çarpık normal dağılım için kontrol grafiğinin kesin sınırları sırasıyla,

$$AKL = \mu_x - \sigma_x(\gamma_1 z_{1-\frac{\alpha}{2}-\lambda} + \gamma_2) \quad ÜKL = \mu_x + \sigma_x(\gamma_1 z_{1-\frac{\alpha}{2}-\lambda} - \gamma_2)$$

şeklinde ve burada $\rho = \frac{\lambda}{\sqrt{1+\lambda^2}}$, $\alpha_1 = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$, $\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{1-\alpha_1^2\rho^2}}$, $\gamma_2 = \frac{\alpha_1\rho}{\sqrt{1-\alpha_1^2\rho^2}}$ olarak belirlenir.

4.1. Ağırlıklı varyans (AV) yöntemi

Ağırlıklı varyans yönteminde, çarpık bir dağılım ortalamaya göre iki parçaya ayrılır ve her parçanın aynı ortalamaya, farklı standart sapmalara sahip yeni simetrik dağılımlar olduğu kabul edilir [7,20].

Süreç parametreleri bilindiği durumda AV yöntemine dayalı kontrol sınırları,

$$\text{ÜKL}_{\bar{X}} = \mu_x + 3 \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} \sqrt{2P_x}$$

$$\text{AKL}_{\bar{X}} = \mu_x - 3 \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} \sqrt{2(1 - P_x)}$$

şeklinde. Burada, P_X kalite değişkeni X ' in süreç ortalaması μ_X ' e eşit veya küçük olma olasılığı $P_X = P(X \leq \mu)$ dir.

4.2. Ağırlıklı standart sapma (ASS) yöntemi

ASS yönteminde çarpık bir dağılım ortalamaya göre iki parçaya ayrılır ve her bir parça yeni simetrik dağılımlar oluşturmak için kullanılır. Yeni simetrik dağılımların standart sapmalarının toplamı σ' ya eşittir ($\sigma = \sigma_U + \sigma_A$) [21]. Süreç parametreleri bilindiğinde ASS yöntemine dayalı kontrol grafiğinin sınırları,

$$\text{ÜKL}_{\bar{X}} = \mu + Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{2\sigma_U^W}{\sqrt{n}} = \mu + Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} 2P$$

$$\text{AKL}_{\bar{X}} = \mu - Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{2\sigma_A^W}{\sqrt{n}} = \mu - Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} 2(1 - P)$$

şeklinde [21].

4.3. Düzeltilmiş çarpıklık (DÇ) yöntemi

Düzeltilmiş çarpıklık yöntemi, dağılımın çarpıklık derecesine bağlı olarak kontrol grafiklerinin oluşturulmasına dayanmaktadır. Bu yöntemde temel dağılım üzerinde herhangi bir varsayım bulunmamaktadır. Klasik Shewhart grafiğinin dağılımın çarpıklığına göre düzeltilmesiyle elde edilen kontrol sınırlarını kullanmamızı sağlamaktadır.

X , ortalama 0, standart sapma 1 ve çarpıklık κ_3 olan bir standartlaştırılmış rastgele değişken olsun. Süreç parametreleri bilindiğinde, DÇ yöntemine dayalı kontrol grafiğinin sınırları,

$$\text{ÜKL}_{\bar{X}} = \mu_x + \frac{(3 + c_4^*)\sigma_x}{\sqrt{n}}$$

$$M\check{C}_{\bar{X}} = \mu_x$$

$$\text{AKL}_{\bar{X}} = \mu_x + \frac{(-3 + c_4^*)\sigma_x}{\sqrt{n}}$$

şeklinde belirlenir [22]. Burada $\kappa_3(\bar{X})$, alt grup ortalaması (\bar{X}) nın çarpıklığı ve

$$c_4^* = \frac{\frac{4}{3}\kappa_3(\bar{X})}{1 + 0.2\kappa_3^2(\bar{X})}$$

şeklindedir.

5. Sağlam yöntemler

Sağlam yöntemler, birçok istatistiksel yöntemde var olan temel normallik varsayımı ihlal edildiğinde en sık kullanılan yöntemlerdir. Sağlam istatistiksel yöntemler normallik varsayımından sapmalar konusunda duyarsız, aykırı değerlerin varlığına karşı dirençli tahmin yöntemleridir. Bu nedenle geleneksel yöntemlere yararlı ve uygulanabilir alternatifler sunmaktadır.

Ölçek tahmin edicileri istatistiksel uygulamalarda çok önemlidir. Ölçeğin en yaygın tahmin edicisi örnek standart sapmasıdır. Ancak örnek standart sapması normal dağılımdan az miktardaki sapmalardan, çarpıklık ve basıklık değerlerinden etkilenen bir tahmin edicidir [23]. Örnek standart sapması normal dağılıma göre basıklığı daha az ya da biraz daha fazla olan dağılımlar için etkinliğini korurken, normal dağılımdan uzaklaştıkça etkinliğini kaybetmektedir [24].

Kalite kontrol çalışmalarında verilerin normal dağılıma varsayımı vardır. Ancak bu durum çoğu zaman sağlanmaz. Bu nedenle kalite kontrol çalışmalarında kontrol limitlerinin belirlenmesinde örnek standart sapmasına alternatif tahmin edicilerin kullanılması önem kazanmıştır.

5.1. Medyan mutlak sapma (MAD)

MAD örnek standart sapmasının sağlam tahmin edicilerinden biridir ve normal olmayan dağılımlarda örnek standart sapmasına göre etkinliği daha yüksektir. MAD tahmin edicisinin kırılma noktası 0.5' dir ve etki fonksiyonu sınırlıdır [25].

X_1, X_2, \dots, X_n m alt gruptan alınan n birimlik rassal örnek olsun. Adekeye ve Azubuiké (2012) MAD'a dayalı \bar{X} grafiğinin kontrol limitlerini aşağıdaki gibi elde etmişlerdir.

$$\text{ÜKL}_{\bar{X}} = \mu_x + \frac{3\sigma_x}{\text{MAD}}$$

$$\text{MÇ}_{\bar{X}} = \mu_x$$

$$\text{AKL}_{\bar{X}} = \mu_x + \frac{3\sigma_x}{\text{MAD}}$$

Burada MAD tahmin edicisi,

$$\text{MAD} = \frac{\text{median}(|x_i - \text{median}(x_i)|)}{0.6745}$$

şeklinde hesaplanmaktadır.

5.2. S_n Tahmin edicisi

MAD tahmin edicisinin avantajları yanında bazı dezavantajları da vardır. MAD, dağılım üzerinde simetrik bir görüş alır, önce merkezi bir değer olan medyan tahmin edilir ve daha sonra ondan pozitif ve negatif sapmalara eşit önem verir. Aslında MAD, medyan etrafında simetrik aralığı bulmaya karşılık gelir. MAD yöntemini çok çarpık dağılımlarda kullanmak verimsiz sonuçlar verebilir.

Rousseeuw ve Croux (1993) tarafından önerilen aynı şekilde başlangıç veya yardımcı ölçek tahminleri olarak kullanılabilir ancak daha verimli ve simetrik dağılımlara meyilli olmayan MAD alternatifler olarak tahmin ediciler geliştirilmiştir. Bunlardan ilki S_n ,

$$S_n = c_n 1.1926 \text{ median}_i \{ \text{median}_j |x_i - x_j| \}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

ile ifade edilir [25].

5.3. Q_n Tahmin edicisi

MAD ve S_n ' e alternatif olan bir diğer sağlam tahmin edici Q_n tahmin edicisidir. Q_n tahmin edicisi asimetrik dağılımlar için uygundur ve kırılma noktası 0.5' dir [25].

$$Q_n = d_n 2.2219 \{ |x_i - x_j|; i < j \}_{(k)}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

Burada, $k = \binom{h}{2} \approx \binom{n}{2}/4$ ve h değeri $\left(\frac{n}{2} + 1\right)$ dir.

5.4. Çeyrekler arası değişim katsayısı

Bir süreçte aykırı değerler olduğunda, süreç dağılımında meydana gelen değişiklikleri izlemek için çeyrekler arası değişim katsayısına dayalı tahmin edicinin kullanılması önerilmektedir [25].

Ölçeğin sağlam bir tahmin edicisi olarak tanımlanan IQR,

$$IQR = \frac{Q_3 - Q_1}{1.34898}$$

şeklinde tanımlanır [26]. IQR tahmin edicisinin kırılma noktası 0.25' dir ve etki fonksiyonu sınırlıdır.

5.5. Gini tahmin edicisi

Ölçeğin bir diğer dayanıklı tahmin edicisi olan Gini aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.

$$Gini = \frac{4}{n-1} \sum_{i=1}^n \left(\frac{2i-n-1}{2n} \right) X_{(i)}$$

Burada $X_{(i)}$ i ' inci sıra istatistiğini göstermektedir. Gini tahmin edicisi aykırı değerlere karşı örnek standart sapması ve değişim aralığından daha sağlam ve etkin bir tahmin edicidir [25].

5.6. Ölçeğin Andrews wave M tahmin edicisi

Ölçeğin Andrews wave M tahmin edicisi aşağıdaki gibidir.

$$S_{wa} = \frac{(cMAD)n^{1/2} [\sum_{|u_i| < 1} \sin^2(\pi u_i)]^{0.5}}{\pi |\sum_{|u_i| < 1} \cos(\pi u_i)|}$$

Burada,

$$u_i = \frac{x_i - M}{cMAD}$$

olarak hesaplanmaktadır [25].

5.7. Biweight midvariance tahmin edicisi

$Q_i = \frac{X_i - M}{K \times \text{MAD}}$ ve $a_i = \begin{cases} 1, & |Q_i| < 1 \\ 1, & |Q_i| \geq 1 \end{cases}$ olmak üzere, Biweight midvariance tahmin edicisinin

karekökü,

$$\hat{\xi}_{bi} = \frac{\sqrt{n} \sqrt{\sum a_i (X_i - M)^2 (1 - Q_i^2)^4}}{|\sum a_i (1 - Q_i^2) (1 - 5Q_i^2)|}$$

şeklinde elde edilir. K değeri olarak 9'un kullanımı genel kabul görmektedir. Bu tahmin edicinin kırılma noktası yaklaşık olarak 0.5'tir [25,27].

6. Monte Carlo benzetim çalışması

Bu kısımda ele alınan kontrol kartlarının performansını karşılaştırmak için bir simülasyon çalışması gerçekleştirilmiştir. AR(1) modelindeki gözlemlerin farklı çarpıklık değerlerine sahip çarpık normal dağılımdan geldiği varsayılmıştır. Çarpık normal dağılımın parametreleri $\lambda = 1.592$, $\delta = 0.196$ ve $\alpha = 0.66, 1.2$ ve 2.17 olarak seçilmiştir. Otokorelasyon değeri literatürde 0-0.30 olduğunda düşük, 0.30-0.70 orta şiddetli ve 0.70'den büyük olduğunda yüksek şiddetli olarak adlandırılmaktadır. Bu nedenle otokorelasyon için $\phi = 0.25, 0.50, 0.75$ ve 0.95 değerleri seçilmiştir. Ortalama kayma miktarları da büyüklüklerine göre küçük, orta ve büyük kaymalar olarak 3'e ayrılmaktadır. Literatürde, küçük kaymaların $\delta \leq 1.5$ 'ten küçük; orta kaymaların $1.5 \leq \delta \leq 2.5$ arasında ve büyük kaymaların 2.5 'ten daha büyük $\delta \geq 2.5$ olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada kayma miktarı için $\delta=0, 0.25, 0.50, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5$ ve 3.0 değerleri göz önünde bulundurulmuştur.

Yukarıda belirtilen parametrelere göre veriler bir AR(1) modelinden üretilmiş ve süreç parametrelerinin bilindiği varsayılarak karşılık gelen artıklar hesaplanmıştır. Kontrol kartlarının performanslarının karşılaştırılmasında ARL ölçütünden yararlanılmıştır.

Bir kontrol grafiğinin en önemli performans ölçüsü ARL' dir. ARL, kontrol dışı bir sinyal olana kadar kontrol grafiğinde beklenen alt grup sayısıdır ve sürecin davranışını değerlendirmek için kullanılır. Eğer süreç kontrol altında ise ilk kontrol grafiği sinyalinden önce beklenen alt grup sayısı, kontrol içi ortalama çalışma uzunluğu olarak adlandırılır ve ARL_0 olarak gösterilir. Eğer süreç kontrol dışında ise ilk kontrol grafiği sinyalinden önce beklenen alt grup sayısına kontrol dışı ortalama çalışma uzunluğu denir ve ARL_1 ile gösterilir. Süreç kontrol altında iken ortalama çalışma uzunluğunun büyük, süreç kontrol dışındayken ortalama çalışma uzunluğunun küçük olması istenir.

Tüm kontrol kartlarının tasarımında $\mp 3\sigma$ ya karşılık gelecek şekilde $\alpha = 0.0027$ olarak seçilmiştir. 10000 tekrarlı bir Monte Carlo simülasyon çalışması sonucunda kontrol kartlarının ARL değerleri aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

$$ARL = \frac{\sum_{i=1}^{10000} RL_i}{10000}$$

Elde edilen sonuçlar Çizelge 1-3' te verilmiştir.

Çizelge 1’ de, $\alpha = 0.66$ ve otokorelasyon değeri $\phi = 0.25$ için ortalamadan kayma miktarı $\delta = 0$ olduğunda bir başka ifade ile süreçte herhangi bir kayma olmadığında AV, ASS ve ÇD yöntemleri için elde edilen ARL değerleri, $ARL_0 = 370$ değerinden küçük olarak tespit edilmiştir. Süreçte herhangi bir kayma olmadığında ARL değerinin büyük, kayma miktarı arttığında ise ARL değerinin düşük olması istenir. Bu nedenle süreç kontrol altında iken bu yöntemlerin yanlış alarm verme sayısı yüksektir. Herhangi bir kayma olmadığında ARL değeri en yüksek olan yöntem S_n tahmin edicisine dayalı kalite kontrol grafiğidir. Bunu izleyen kontrol grafikleri sırasıyla, MAD, Q_n , Andrew, Biweight, Gini, IQR ve ÇN’ dir.

$\delta = 0.25$ olduğunda en küçük ARL değerine sahip kontrol kartının en etkin kart olduğu söylenir. Bu nedenle kayma miktarı 0.25 olduğunda en küçük ARL değerine sahip olan kontrol grafikleri ASS, ÇD, AV, Q_n şeklinde sıralanmaktadır. Kayma miktarı $\delta = 0.5$ olduğunda sağlam tahmin edicilere dayalı kontrol grafiklerinin ARL değerlerinin en düşük olduğu tespit edilmiştir. Kayma miktarı arttıkça tüm kontrol grafiklerinin ARL değerleri azalmakta, ancak en küçük ARL değerine sahip olan kontrol grafiği S_n tahmin edicisine dayalı kalite kontrol grafiğidir.

Otokorelasyon değeri $\phi = 0.5$ olduğunda süreç ortalamasında herhangi bir kayma söz konusu değilken tüm kontrol grafiklerinin ARL değerlerinin azaldığı görülmektedir. Benzer şekilde en yüksek ARL değerine sahip kontrol grafiği S_n tahmin edicisine dayalı kalite kontrol grafiğidir.

Otokorelasyon değeri $\phi = 0.75$ olduğunda da benzer sonuçlar elde edilmiştir.

Tablo 2’de, dağılımın çarpıklık parametresi $\alpha = 2.17$ olduğunda kayma miktarı $\delta = 0$ iken benzer olarak AV, ASS ve ÇD kontrol grafiklerinin ARL değerleri 370 değerinden daha küçüktür. Dağılımın çarpıklık değeri arttığında kontrol grafiklerinin performansı benzer şekilde devam etmektedir.

S_n tahmin edicisine dayalı kalite kontrol grafiğinin dağılımın tüm çarpıklık parametre değerlerinde ve otokorelasyon düzeylerinde istenilen daha büyük bir kontrol içi ARL_0 değerine ve daha küçük bir kontrol dışı ARL_1 değerine sahip olduğu belirlenmiştir.

7. Öneriler

Bu çalışmada, birinci dereceden otokorelasyonlu veriler için çarpık normal dağılıma dayalı artık kontrol grafikleri için çeşitli yöntemler ele alınmıştır. Kalite kontrol çalışmalarında kullanım kolaylığı nedeniyle çokça tercih edilen kontrol kartlarının temel iki varsayımının sağlanmaması durumunda ele alınan bu kontrol grafiklerinin performansı ARL değerleri üzerinden karşılaştırılmıştır. Verilerin normal dağılıma sahip olmama durumu için alternatif olarak çarpık normal dağılım, otokorelasyonlu olması durumu için ise AR(1) süreci göz önünde bulundurulmuştur. Süreç ortalamasında herhangi bir kayma olmaması durumunda en yüksek ARL değerine sahip yöntem S_n tahmin edicisine dayalı yöntemdir. Geleneksel kullanıma sahip olan AV, ASS ve ÇD yöntemlerinin kontrol içi ARL değerleri ele alınan tüm durumlarda arzu edilen 370 değerinden oldukça küçüktür. Bu nedenle yanlış alarm değerleri yüksektir. Kontrol dışı durum için istenilen en küçük ARL değerini veren kontrol grafiği kayma miktarı 0.50 den büyük olduğunda benzer şekilde S_n tahmin edicisine dayalı kontrol grafiğidir. Bu nedenle hem otokorelasyonlu hem de çarpık dağılıma sahip süreçler için S_n tahmin edicisine dayalı kontrol grafiğinin kullanılması yanlış alarm olasılığının azalmasına neden olacaktır.

Kaynaklar

- [1] Işığışık, E. (2012). Toplam kalite yönetimi bakış açısıyla istatistiksel kalite kontrol, Bursa: Ezgi Yayınevi.
- [2] Montgomery, D.C., 2009, Introduction to Statistical Process Control, John Wiley & Sons, Inc., p.13.
- [3] Birgören, B., 2015, İstatistiksel kalite kontrolü. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

- [4] Shewhart, W.A., 1931, Economic Control of Quality of Manufactured Product, American Society for Quality Control, p.145.
- [5] Qui, P., 2013, Introduction to Statistical Process Control, Texts in Statistical Science, p.74.
- [6] Öztürk, A., 2009, Kalite yönetimi ve planlaması. Bursa:Ekin Yayınları.
- [7] Bai, D.S., Choi, I.S., 1995, \bar{X} and R control charts for skewed populations, Journal of Quality Technology, 27,2, 120-131.
- [8] Karaoğlan, A. D., 2010, CONTROL CHARTS FOR AUTOCORRELATED PROCESSES: A REVIEW Engineering Sciences, 5(2), 243-25.
- [9] Karaoğlan, A., Bayhan, G., 2011, Performance Comparison of Residual Control Charts for Trend Stationary First Order Autoregressive Processes, Gazi University Journal of Science, 24(2), 329-339.
- [10] Tsai, Tzong-Ru., 2007, Skew normal distribution and the design of control charts for averages, International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering, 14,1, 49- 63.
- [11] Tsai, Tzong-Ru., Chiang, Jyun-You., 2008, The design of acceptance control chart for non-normal data, Journal of The Chinese Institute of Industrial Engineers, 25:2, 127-135.
- [12] Li, Chung-I., Su, Nan-Cheng., Su, Pei-Fang., Shyr, Yu., 2014, The design \bar{X} of and R control charts for skew normal distributed data, Communications in Statistics - Theory and Methods, 43:23, 4908-4924.
- [13] Li, C., Mukherjee, A., Su, Q., Xie, M., 2019, Some monitoring procedures related to asymmetry parameter of azzalini's skew-normal model. Revstat - Statistical Journal, 17,1, 1-24.
- [14] Figueiredo, F., Gomes, M.I., 2013, The skew-normal distribution in SPC, Revstat – Statistical Journal, 11,1, 83-104.
- [15] Alwan, L.C., Roberts, H.V., 1988, Time-series modeling for statistical process control, Journal of Business & Economic Statistics, 6(1), 87–95.
- [16] Thomas R. Willemain, George C. Runger, 1996, Designing Control Charts Using an Empirical Reference Distribution, Journal of Quality Technology, 28:1, 31-38.
- [17] Ma, X., Zhang, L., Hu, J., Palazoglu, A., 2018, A model-free shewhart individuals control chart for autocorrelated data, 10th IFAC International Symposium on Advanced Control of Chemical Processes, Chine, July 25-27.
- [18] Mishra, U., Singh, J.R., 2020, Effect of first order auto-regressive model on the power function of average control charts under non-normal population, Sri Lankan Journal of Applied Statistics, 21(2), 26–37.
- [19] Gorgin, V., Gildeh, B.S., 2020, MAD control chart for autoregressive models with skew-normal distribution, Stochastics and Quality Control, 35,1, 17-23.
- [20] Choobineh, F., Ballard, J.L., 1987, Control-limits of QC charts for skewed distributions using weighted-variance, IEEE Transactions on Reliability, R-36,4, 473-477.
- [21] Chang, Y.S., Bai, D.S., 2001, Control charts for positively-skewed populations with weighted standard deviation, Quality and Reliability Engineering International, 17, 397-406.
- [22] Chan, L.K., Cui, H.J., 2003, Skewness correction \bar{X} and R charts for skewed distributions, Naval Research Logistics, 50, 555 – 573.
- [23] Tukey, J.W., 1960, A Survey of Sampling from Contaminated Distributions. In: Oklin, I., Ed., Contributions to Probability and Statistics, Stanford University Press, Redwood City, CA.

- [24] Hoaglin DC, Mosteller F, Tukey JW, eds, 2000, Understanding Robust and Exploratory Data Analysis. New York: Wiley-Interscience.
- [25] Wilcox, R., 2012, Introduction to robust estimation and hypothesis testing. 3rd ed.
- [26] Riaz, M., 2008, A dispersion control chart, *Communications in Statistics - Simulation and Computation*, 37:6, 1239-1261.
- [27] Goldberg, K. M., Iglewicz, B., 1992, Bivariate Extensions of the Boxplot. *Technometrics*, 34(3), 307–320.
- [28] Rousseeuw, P.J., Croux, C., 1993, Alternatives to median absolute deviation, *Journal of the American Statistical Association*, 88:424, 1273 - 1283.